



中华人民共和国国家标准

GB/T 17553.2—2000
idt ISO/IEC 10536-2:1995

识别卡 无触点集成电路卡 第2部分：耦合区域的尺寸和位置

Identification cards—Contactless integrated circuit(s) cards—
Part 2: Dimensions and location of coupling areas

2000-10-17发布

2001-10-01实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
ISO/IEC 前言	II
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义、缩略语和符号	1
4 耦合区域的尺寸	2
5 耦合区域的数量和位置	2
附录 A(提示的附录) X 轴和 Y 轴上的尺寸——测量方法	4
附录 B(提示的附录) CICC 和 CCD 上耦合元件的举例	4

前　　言

本标准等同采用国际标准 ISO/IEC 10536-2:1995《识别卡 无触点集成电路卡 第 2 部分:耦合区域的尺寸和位置》。

GB/T 17553 在总标题《识别卡 无触点集成电路卡》下,包括下述部分:

- 第 1 部分:物理特性;
- 第 2 部分:耦合区域的尺寸和位置;
- 第 3 部分:电信号和复位规程。

本标准的附录 A、附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由信息产业部电子工业标准化研究所归口。

本标准起草单位:信息产业部电子工业标准化研究所。

本标准主要起草人:金倩、陈云峰、黄家英、王爱英。

ISO/IEC 前言

ISO(国际标准化组织)和 IEC(国际电工委员会)建立了世界范围标准化的专门系统。ISO 或 IEC 的国家成员团体通过国际组织建立的各个技术委员会参与制定针对特定技术领域的国际标准。ISO 和 IEC 技术委员会在共同感兴趣的领域合作。其他与 ISO 和 IEC 有联系的官方和非官方的各国际组织也参与此项工作。

在信息技术领域,ISO 和 IEC 建立了一个联合技术委员会,即 ISO/IEC JTC1。由联合技术委员会提出的国际标准草案需分发给各成员团体进行表决。作为国际标准发布至少需要 75% 的成员团体投票赞成。

国际标准 ISO/IEC 10536-2 由联合技术委员会 ISO/IEC JTC1(信息技术)的分委员会 SC 17(识别卡及相关设备)制定。

ISO/IEC 10536 在总标题《识别卡 无触点集成电路卡》下,包括下述部分:

- 第 1 部分:物理特性;
- 第 2 部分:耦合区域的尺寸和位置;
- 第 3 部分:电信号和复位规程。

附录 A、附录 B 仅提供参考信息。

中华人民共和国国家标准

识别卡 无触点集成电路卡 第2部分：耦合区域的尺寸和位置

GB/T 17553.2—2000
idt ISO/IEC 10536-2:1995

Identification cards—Contactless integrated circuit(s) cards—
Part 2:Dimensions and location of coupling areas

1 范围

本标准规定了每一个用于提供接口槽或表面卡耦合装置(CCDs)和ID-1型的无触点集成电路卡(CICCs)的耦合区域的尺寸、位置、属性和作用。

本标准没有规定：

CICC上的耦合元件的尺寸、位置和作用；

CCD上的耦合元件的尺寸、位置和作用；

产生耦合域的方法。

本标准与GB/T 17553.1相结合起来加以使用。

附录A示出了用于将域位置与CICC联系起来的X轴与Y轴上的尺寸。

附录B示出了在CICC和CCD上都有的耦合元件的例子。

本标准用到的尺寸均以名词示出并用毫米表示；图示没有按比例示出。

注：以各种距离操作的其他类型CICC，其格式或接口可以在将来进行开发，他们可以要求对本标准进行补充，或要求制定其他国际标准。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14916—1994 识别卡 物理特性(idt ISO 7810:1985)

GB/T 17553.1—1998 识别卡 无触点集成电路卡 第1部分：物理特性(idt ISO/IEC 10536-1:1992)

3 定义、缩略语和符号

3.1 定义

GB/T 17553.1中给出的定义和下列定义适用于本标准：

3.1.1 电感耦合区域 inductive coupling area

使电感耦合元件工作的磁通量集中的区域。

3.1.2 电容耦合区域 capacitive coupling area

在CICC和CCD之间电容耦合可以发生的区域。

3.2 缩略语

3.2.1 CICC